

## Session posters : 18h20 à 20h30

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2026

### 1. Instruments et techniques de faisceaux d'ions

- #01 - Vingt ans d'innovations techniques et perspectives futures de la plateforme JANNuS-Saclay  
**B. Ridard<sup>1</sup>**, **P. Billaud<sup>1</sup>**, **G. Gutierrez<sup>1</sup>**, **C. Bernard<sup>1</sup>**, **H. Martin<sup>1</sup>**, **F. Nozais<sup>1</sup>**, **G. Sagnes<sup>1</sup>**,  
**M. Thiebault<sup>1</sup>**, **J.L. Bechade<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> CEA - S2CM/SRMP/JANNuS - Gif-Sur-Yvette (FR)

<sup>2</sup> CEA - INSTN Saclay - Gif-Sur-Yvette (FR)

- #51 - Complementary PIXE–RBS analysis for complex semiconductor nanostructures using multi-detector configurations

**T. Vanmeerbeek<sup>1,2</sup>**, **A. Vantomme<sup>1</sup>**, **J. Meersschaut<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> KU Leuven - Leuven (BE)

<sup>2</sup> IMEC - Leuven (BE)

### 2. Physique des interactions ions-matière à toutes les échelles

- #06 - Proton-induced cross-section measurements for the characterization of Li-, F-, and B-based thin films

**S. Sorieul<sup>1</sup>**, **S. Pellegrino<sup>2</sup>**, **S. Vaubaillon<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> CNRS/LP2iB - Gradignan (FR)

<sup>2</sup> CEA - Saclay (FR)

<sup>3</sup> UB/LP2iB - Saclay (FR)

### 3. Faisceaux d'ions pour l'analyse et la modification de matériaux

- #17 - Approche métrologique pour fiabiliser le profilage de l'hydrogène par RNRA

**C. Forgiione<sup>1</sup>**, **L. Dupont<sup>2</sup>**, **P.L. Debarsy<sup>3</sup>**, **J.L. Colaux<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Département de Physique, UNamur - Namur (BE)

<sup>2</sup> Département de Physique, NISM, UNamur - Namur (BE)

<sup>3</sup> SIAM, UNamur - Namur (BE)

- #18 - Nettoyage contrôlé de l'extrême surface pour le profilage RNRA sur acier inox en contexte nucléaire

**M. Fromont<sup>1</sup>**, **L. Dupont<sup>2</sup>**, **P.L. Debarsy<sup>3</sup>**, **J.L. Colaux<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Département de Physique, UNamur - Namur (BE)

<sup>2</sup> Département de Physique, NISM, UNamur - Namur (BE)

<sup>3</sup> SIAM, UNamur - Namur (BE)

- #32 - Films minces de SnO<sub>2</sub> à chimie des défauts contrôlée par ALD thermique : élucidation de la structure électronique gouvernée par les défauts pour le transport de charge

**B. Xia**, **I. Vickridge**, **J.J. Ganem**, **E. Briand**, **S. Steydli**

Institut des NanoSciences de Paris - Paris (FR)

- #57 - AI-assisted ion beam analysis: toward explainable and uncertainty-aware spectrum interpretation

**M. Han<sup>1</sup>**, **F. Garrido<sup>1</sup>**, **H. Khodja<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> IJCLab - Orsay (FR)

<sup>2</sup> CEA/Saclay - Gif-Sur-Yvette (FR)

## 5. Faisceaux d'ions pour les sciences de la Terre et de l'environnement

#14 - Development of a compact low-background set-up for gamma spectroscopy

**P.-L. Debarsy<sup>1</sup>, C. Stasser<sup>2</sup>, G. Terwagne<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> SIAM – Univ. Namur (BE)

<sup>2</sup> Univ. Namur (BE)

#19 - Study of the degradation of biosignatures under simulated martian irradiation using GEANT4

**B. Duarte Dos Santos<sup>1</sup>, A. Canizarès<sup>2</sup>, P. Sigot<sup>2</sup>, O. Wendling<sup>2</sup>, A. Bellamy<sup>2</sup>, W. Hate<sup>2</sup>,  
T. Sauvage<sup>2</sup>, F. Foucher<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Univ. Orléans, CNRS, CEMHTI UPR 3079 - Orléans (FR)

<sup>2</sup> CNRS, Univ. Orléans, CEMHTI UPR 3079 - Orléans (FR)

#20 - Au-delà des compositions moyennes : apport des cartographies  $\mu$ -PIXE à l'étude des colorations exceptionnelles des spéléothèmes issus de la grotte de la Cigalère (Ariège, France)

**M. Labruyère<sup>1</sup>, L. Baseil<sup>2</sup>, M. Vlieghe<sup>3</sup>, J. Yans<sup>3</sup>, J.L. Colaux<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Département de Physique, UNamur (BE)

<sup>2</sup> Département de Physique, NISM, UNamur (BE)

<sup>3</sup> Département de Géologie, ILEE, UNamur (BE)

#53 - Traitement des PFAS par faisceau d'électrons à très haut débit de dose : une approche de modélisation radio-cinétique pour élucider la chimie radicalaire dépendante du débit de dose

**R. Tonneau<sup>1</sup>, R. Labarbe<sup>2</sup>, S. Aude<sup>2</sup>, G. Eppe<sup>3</sup>, J. Aline<sup>4</sup>, L. Stéphane<sup>1</sup>, A.C. Heuskin<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Univ. Namur (BE)

<sup>2</sup> IBA - Louvain-la-Neuve (BE)

<sup>3</sup> Univ. Liège (BE)

<sup>4</sup> Haemers Technologies - Nivelles (BE)

#58 - Analyse multi-élémentaire et représentation 2D des éléments dans les racines et les feuilles de plants d'*Oryza glaberrima* au stade végétatif par les méthodes combinées PIGE, RBS, PIXE et GC-TDS

**A. Traore<sup>1</sup>, N. Anna<sup>2</sup>, F. Sabrina<sup>3</sup>, F. Jean Paul Laty<sup>4</sup>, M. Baboucarr<sup>5</sup>, K. Jan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Institute de Technologie Nucléaire Appliquée, Univ. Cheikh Anta Diop - Dakar (SN)

<sup>2</sup> Département de Chimie, Univ. Cheikh Anta Diop - Dakar (SN)

<sup>3</sup> Nuclear Physics Institute CAS, Husinec - Řež (CZ)

<sup>4</sup> Département de Physique, Univ. Cheikh Anta Diop - Dakar (SN)

<sup>5</sup> Africa Rice Center - Abidjan (CI)